

2020年度 半導体標準化専門委員会 功労賞 受賞者

○半導体パッケージング技術委員会

【功労賞】

受賞者：新井 規由（あらい きよし）【三菱電機株式会社】

<受賞理由>

パワー半導体パッケージ PG 主査として、熱設計サブコミティとの連携を図り、強力に推進しているばかりでなく、JEITA 内の他の三次元 CAD 情報標準化委員会とも連携し、外形図のための幾何公差の講師を招聘するなどして、会員企業の技術力向上にも多大な貢献をしている。

○集積回路&システムレベル技術委員会

【功労賞】

受賞者：大野 剛史（おおの つよし）【ルネサスエレクトロニクス株式会社】

<受賞理由>

2016年度より IEC SC47A エキスパートとして IEC SC47A WG2(モデリング) WG9(試験法)へ参画し、日本意見の反映と規格制定に積極的に関与。また2017年度より半導体 EMC-SC 内、実証実験 SWG リーダとして半導体レベルの EMC 実証実験を取りまとめた。特に日本が提案中の CXPI 試験法規格(IEC 62228-7) 提案においては、規格案の試験に対する検証を主導し、正当性の確保に大きく貢献した。

また、半導体 EMC に対する課題の提起と方向性などをセミナーで発表し、JEITA 活動のプレゼンスを大いに高める取り組みを行っており、標準化活動への貢献は顕著である。

○個別半導体製品技術委員会

【功労賞】

受賞者：中山 雅央（なかやま まさお）【ヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社】

<受賞理由>

2002年より IEC SC47E/WG2 国内委員会に参画、2017年より同委員会主査を担当、マイクロ波半導体測定方法に関する多数の国際規格策定及び審議を推進してきた。近年では、IEC 60747-16-5(発振器規格)や、JEITA マイクロ波トランジスタ規格改正のプロジェクトリーダーとして、規格策定活動を主導している。

<経歴>

2002年より IEC SC47E/WG2 国内委員会（マイクロ波半導体測定方法）に参画

2017年より IEC SC47E/WG2 国内委員会 主査

2019年より 個別半導体製品技術委員会 委員、マイクロ波グループ リーダ

IEC 60747-16-5(発振器規格)追補 プロジェクトリーダー

JEITA マイクロ波トランジスタ規格(ED-4359)改正 プロジェクトリーダー

2020 年度 半導体標準化専門委員会 功労賞 受賞者

○半導体信頼性技術委員会

【功労賞】

受賞者：村田 親一（むらた しんいち）

<受賞理由>

- ・1995 年第 1 回信頼性サブコミッティから JEITA 信頼性技術委員会 信頼性サブコミッティに参加し、26 年間信頼性試験規格作成に貢献いただいた。
- ・また認定ガイドライン及び信頼性用語 TF にも参加戴き。EDR-4708「半導体集積回路認定ガイドライン」作成に中心的役割を担っていただいた。
- ・2020 年度は、EDR-4704B「半導体デバイスの加速寿命試験運用ガイドライン」の改定に貢献いただいた。

○半導体&システム設計技術委員会

【功労賞】

受賞者：大野 めぐみ（おおの めぐみ）【株式会社ソシオネクスト】

<受賞理由>

電気シミュレーションモデルの標準である IBIS S モデルにおいて、制定団体の IBIS OPEN FORUM に対して IBIS の改良として On Die PDN のモデルを適用できるよう提案（BIRD）を行い正式に採用され発行された。

提案に伴い、同団体が主催する IBIS Summit の日本および米国開催において発表を行い、採用を訴えるなど精力的な活動を行った。また、同氏は、IEC 63055/IEEE 2401LPB 相互設計標準フォーマット（JEITA 提案規格）を社内製品の開発に積極的に採用するなどの普及活動にも貢献している。

以上